

AXA シリーズ その他試験レポート目次

■ データの利用上の注意	2
■ 初期接触抵抗	AXA2S73062-M 3
■ 絶縁抵抗	AXA2S73062-M 4
■ 耐電圧	AXA2S73062-M 5
■ カードロック力 解除力	AXA2S73062-M 6
■ 半田耐熱性(リフロー耐熱)	AXA2S73062-M 7~8
■ 半田耐熱性(手半田耐熱)	AXA2S73062-M 9~10
■ 耐湿性	AXA2S73062-M 11~12
■ 耐熱衝撃性	AXA2S73062-M 13~14
■ 硫化水素性	AXA2S73062-M 15~16

※一部の評価データを代表例として公開しています。

サイト上に掲載のないデータについては、個別にお問い合わせをお願いいたします。

※特定商品の個別評価データについては、商品検索ページに掲載がございます。

本資料の記載情報またはそれに関するデータの利用上の注意

本資料に記載されている商品情報、またはそれに関するデータにつきましては、以下の内容を事前にご確認いただいたうえでご利用願います。本資料をご利用した時点で、以下内容に同意されたものとさせていただきますので、ご利用の前に必ずお読みください。

■本資料はお客様の性能を保証するものではなく、初期確認用の参考情報です。商品の改良等のために予告なく仕様や掲載情報を変更する場合があります、商品の仕様については正式に取り交わした仕様書に基づくものとします。採用のご検討やご注文の際は、当社販売窓口までお問い合わせのうえ、納入仕様書の取り直しをお願いいたします。

■当社は品質・信頼性の向上に努めておりますが、万が一に備え、十分な安全設計をお願いします。設計に際しては最大定格、動作電源電圧、動作温度など保証範囲内でお使いください。保証値を超えての使用など、本資料に記載のある商品の誤った使用または不適切な使用などに起因する商品の運用結果につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■本資料に記載されている商品は、一般電子機器（情報機器、通信機器、音響映像機器、計測機器等）に使用されることを意図しています。特別な品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある装置やシステム（交通機器、安全装置、航空・宇宙用、原子力制御、生命維持装置を含む医療機器など）にご使用をお考えのお客様は当社販売窓口までご相談ください。なお、相談なく使用されたことにより発生した損害等については、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

■本資料に記載されている技術情報は、商品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際しての当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または許諾を行うものではありません。

■本資料に記載されている商品の正規販売チャネル以外でのご購入または模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

■本資料に記載されている商品のうち、外国為替及び外国貿易管理法に定める規制対象貨物・役務の輸出に際しては、同法に基づく輸出許可・承認が必要です。

■本資料は、予告なしに変更されることがあります。データに対する内容変更の連絡は行いません。また、本データ内容の変更、削除および改変によって生じたいかなる障害損失について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

初期接触抵抗 TEST REPORT

品名： SDメモリーカード用ソケット
 データ No.： AXA2S73062-M-001
 ページ No.： 1 / 1

目的

初期接触抵抗を確認する

試料

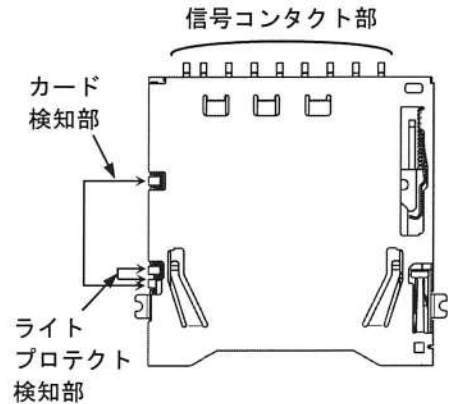
SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
 カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

JIS C5402 5.2に準拠して、各端子間(信号・検知)の接触抵抗を測定する
 (開路電圧： 20mV以下 閉路電流： 10mA以下)
 使用カード： Panasonic社製評価用SDメモリーカード

判定基準

初期接触抵抗
 信号コンタクト部： 100mΩ以下
 カード検知部： 150mΩ以下
 ライトプロテクト検知部： 150mΩ以下



試験結果

信号コンタクト： 45端子、検知コンタクト： 15端子 [mΩ]

	信号コンタクト部	検知コンタクト部	
		カード検知部	ライトプロテクト検知部
Avg.	16.050	41.750	33.683
Max.	19.79	42.26	35.02
Min.	13.50	41.25	32.14

結論

性能を満足する

絶縁抵抗 TEST REPORT

品名： SDメモリーカード用ソケット
データ No.： AXA2S73062-M-002
ページ No.： 1 / 1

目的

絶縁抵抗を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

絶縁抵抗計にて隣接コンタクト間(カード未嵌合状態)及びシェル各コンタクト間(カード嵌合状態)の絶縁抵抗を測定する
D.C.500Vメガーにて1分間で測定

判定基準

絶縁抵抗： 1,000MΩ以上(初期)

試験結果

隣接コンタクト間： 50端子、シェル各コンタクト間： 60端子

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	すべて1,000MΩ以上
シェル各コンタクト間	

結論

性能を満足する

本多通信工業株式会社	日付 2011.04.05	承認 	評価 —	検印 	作成 
------------	------------------	---	---------	---	---

耐電圧 TEST REPORT

品名：SDメモリーカード用ソケット
データ No.：AXA2S73062-M-003
ページ No.：1 / 1

目的

耐電圧を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

耐電圧計にて隣接コンタクト間(カード未嵌合状態)及びシェル—各コンタクト間(カード嵌合状態)にA.C.500V・1分間印加し、検知電流1.0mAにて測定する

判定基準

短絡、絶縁破壊等のなきこと

試験結果

隣接コンタクト間：50端子、シェル—各コンタクト間：60端子

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題なし
シェル—各コンタクト間	

結論

性能を満足する

カードロック力
カードロック解除力

TEST REPORT

品名： SDメモリーカード用ソケット

データ No.： AXA2S73062-M-004

ページ No.： 1 / 1

目的

カードロック力とカードロック解除力を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

専用挿抜試験機にて測定する
使用カード： Panasonic社製評価用SDメモリーカード

判定基準

- ・カードロック力 : 40N以下
- ・カードロック解除力： 1N以上 40N以下

試験結果

[N]

	カードロック力	カードロック解除力
Avg.	9.658	9.581
Max.	9.90	9.86
Min.	9.28	9.37

- ・カードロック力 : カード挿入時にカムロックに必要な荷重
- ・カードロック解除力： カード抜去時にカムロック解除に必要な荷重

結論

性能を満足する

本多通信工業株式会社

日付
2011.04.05

承認


評価
—

検印


作成


目的

半田耐熱性(リフロー耐熱)を確認する

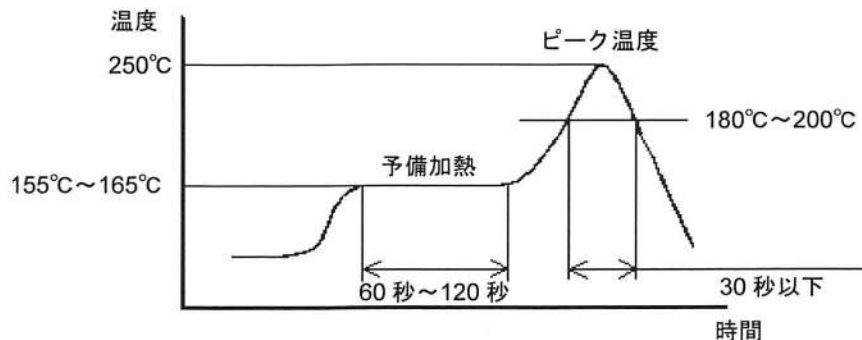
試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

下記条件でコネクタを実装する

- 1) 使用半田クリーム： 千住金属工業(株)製 M705
- 2) メタルマスク厚： 120 μ m
- 3) 基板厚み： t = 1.0mm (FR-4)
- 4) リフロー条件：

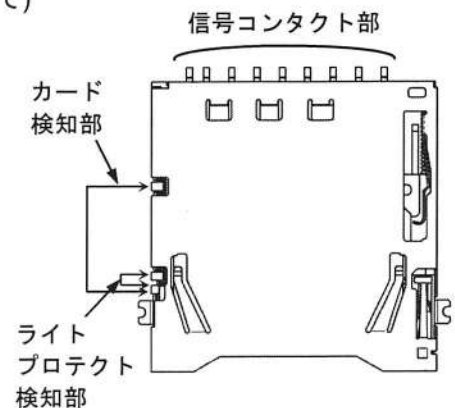


リフロー温度プロファイル推奨条件

判定基準

リフロー2回後

- a) 外観： 絶縁体の変形、クラックなきこと
半田の這い上がりなきこと
- b) 絶縁抵抗： 1,000M Ω 以上 (D.C.500Vにて)
- c) 耐電圧： A.C. 500V・1分間 (検知電流1mAにて)
- d) 接触抵抗
信号コンタクト部： 100m Ω 以下
カード検知部： 150m Ω 以下
ライトプロテクト検知部： 150m Ω 以下
- e) カードロック力： 40N以下
- f) カードロック解除力： 1N以上 40N以下



試験結果

a) 外観 : 絶縁体の変形、クラックは見られない
半田の這い上がりは見られない

b) 絶縁抵抗

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	すべて1,000MΩ以上
シェルー各コンタクト間	

c) 耐電圧

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題なし
シェルー各コンタクト間	

d) 接触抵抗

[mΩ]

	信号コンタクト部	検知コンタクト部	
		カード検知部	ライトプロテクト検知部
Avg.	15.988	42.382	34.208
Max.	20.99	43.66	34.84
Min.	13.75	40.83	33.73

e) カードロック力

[N]

	結果
Avg.	9.632
Max.	9.97
Min.	9.25

f) カードロック解除力

[N]

	結果
Avg.	9.663
Max.	9.93
Min.	9.37

結論

性能を満足する

目的

半田耐熱性(手半田耐熱)を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

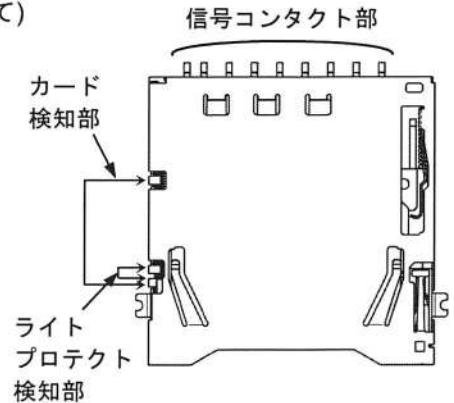
下記条件でコネクタを実装する

- 1) 使用半田クリーム： 千住金属工業(株)製 M705
- 2) 基板厚み： t = 1.0mm (FR-4)
- 3) 半田こて先条件：
温度： 300°C 時間： 5秒

判定基準

試験後

- a) 外観： 絶縁体の変形、クラックなきこと
半田の這い上がりなきこと
- b) 絶縁抵抗： 1,000MΩ以上 (D.C.500Vにて)
- c) 耐電圧： A.C. 500V・1分間 (検知電流1mAにて)
- d) 接触抵抗
信号コンタクト部： 100mΩ以下
カード検知部： 150mΩ以下
ライトプロテクト検知部： 150mΩ以下
- e) カードロック力： 40N以下
- f) カードロック解除力： 1N以上 40N以下



試験結果

- a) 外観： 絶縁体の変形、クラックは見られない
半田の這い上がりは見られない
- b) 絶縁抵抗

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	すべて1,000MΩ以上
シェルー各コンタクト間	

- c) 耐電圧

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題なし
シェルー各コンタクト間	

d) 接触抵抗

[mΩ]

	信号コンタクト部	検知コンタクト部	
		カード検知部	ライトプロテクト検知部
Avg.	18.281	44.081	31.906
Max.	20.71	45.13	33.20
Min.	15.85	42.22	30.26

e) カードロック力

[N]

	結果
Avg.	9.730
Max.	10.25
Min.	9.31

f) カードロック解除力

[N]

	結果
Avg.	9.513
Max.	9.93
Min.	9.11

結論

性能を満足する

目的

耐湿性を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
 カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

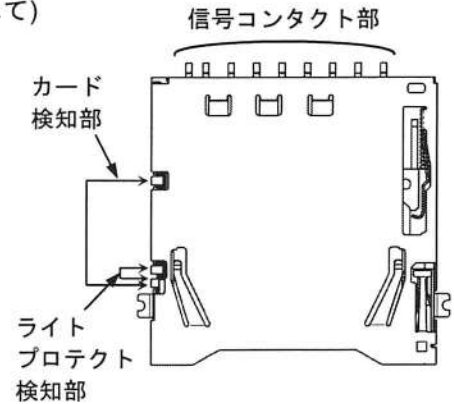
試験方法

温度： +40°C
 上限湿度： 95%RH
 下限湿度： 90%RH
 放置状態： 嵌合状態

判定基準

500時間放置後

- a) 外観： 変形、ソリ、クラックの発生なきこと
 b) 絶縁抵抗： 100MΩ以上 (D.C.500Vにて)
 c) 耐電圧： A.C. 500V・1分間 (検知電流1mAにて)
 d) 接触抵抗
 信号コンタクト部： 変化量40mΩ以下
 カード検知部： 150mΩ以下
 ライトプロテクト検知部： 150mΩ以下
 e) カードロック力： 40N以下
 f) カードロック解除力： 1N以上 40N以下



試験結果

- a) 外観： 変形、ソリ、クラックの発生は見られない

- b) 絶縁抵抗

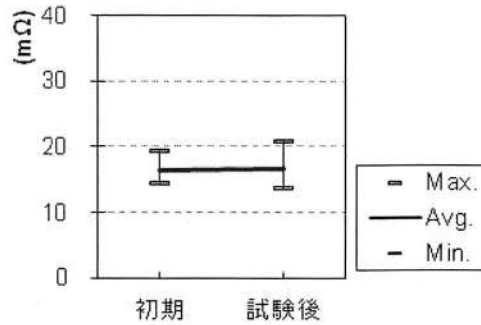
測定箇所	結果
隣接コンタクト間	すべて100MΩ以上
シェルー各コンタクト間	

- c) 耐電圧

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題なし
シェルー各コンタクト間	

d) 接触抵抗

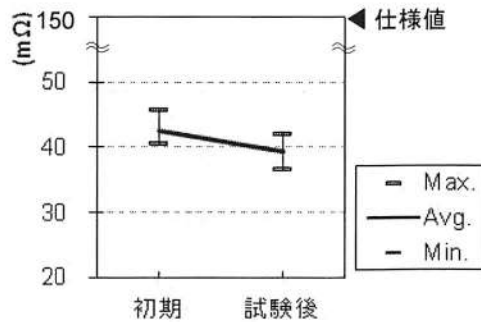
・信号コンタクト部



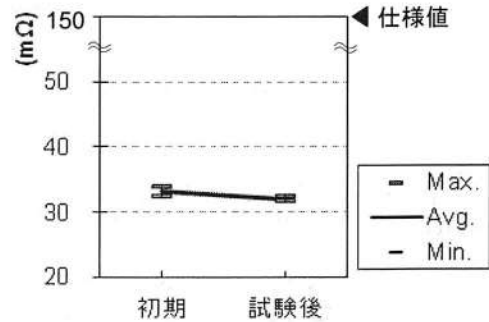
変化量 [mΩ]

Avg.	0.292
Max.	3.10
Min.	-2.22

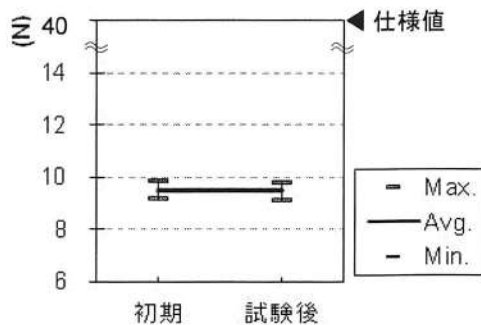
・カード検知部



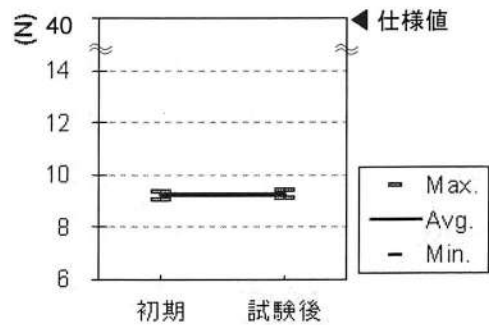
・ライトプロテクト検知部



e) カードロック力



f) カードロック解除力



結論

性能を満足する

目的

耐熱衝撃性を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

上限温度： +85°C

下限温度： -55°C

時間： 各30分

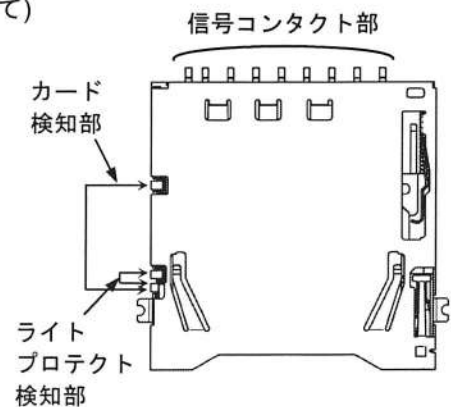
切換え時間： 5分以内

放置状態： 嵌合状態

判定基準

5サイクル後

- a) 外観： 変形、ソリ、クラックの発生なきこと
 b) 絶縁抵抗： 100MΩ以上 (D.C.500Vにて)
 c) 耐電圧： A.C. 500V・1分間 (検知電流1mAにて)
 d) 接触抵抗
 信号コンタクト部： 変化量40mΩ以下
 カード検知部： 150mΩ以下
 ライトプロテクト検知部： 150mΩ以下
 e) カードロック力： 40N以下
 f) カードロック解除力： 1N以上 40N以下



試験結果

- a) 外観： 変形、ソリ、クラックの発生は見られない
 b) 絶縁抵抗

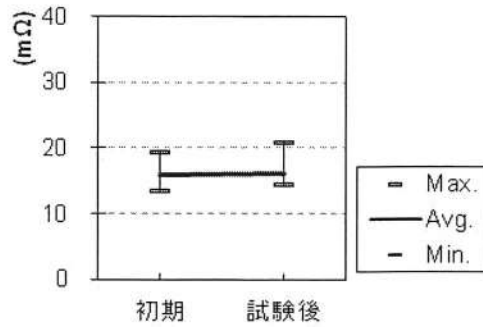
測定箇所	結果
隣接コンタクト間	すべて100MΩ以上
シェルー各コンタクト間	

- c) 耐電圧

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題なし
シェルー各コンタクト間	

d) 接触抵抗

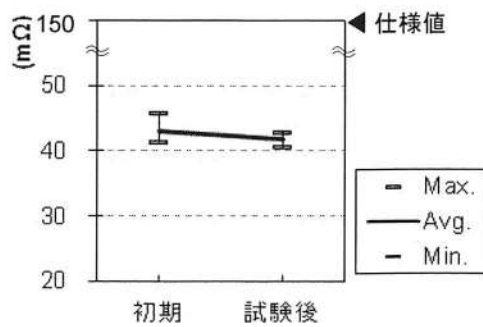
・信号コンタクト部



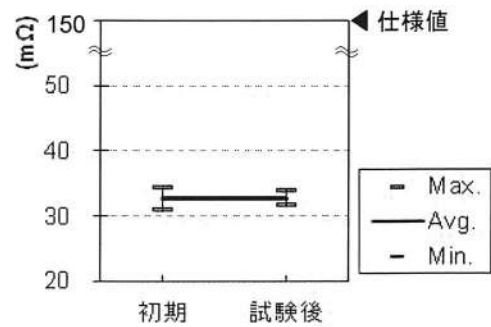
変化量 [mΩ]

Avg.	0.324
Max.	3.16
Min.	-2.29

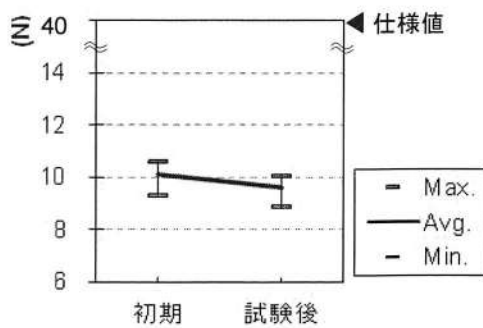
・カード検知部



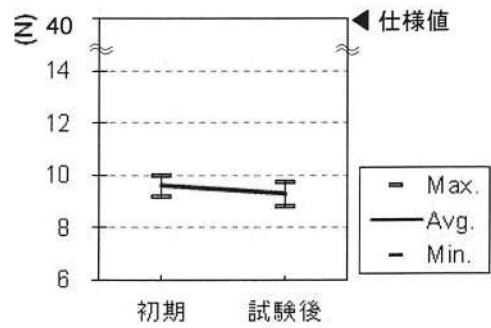
・ライトプロテクト検知部



e) カードロック力



f) カードロック解除力



結論

性能を満足する

目的

硫化水素性を確認する

試料

SDメモリーカード用ソケット SDIO対応品 Sタイプ 標準 スタンドオフ0mm
カード飛び出し防止機能有り 【AXA2S73062-M】 (n=5)

試験方法

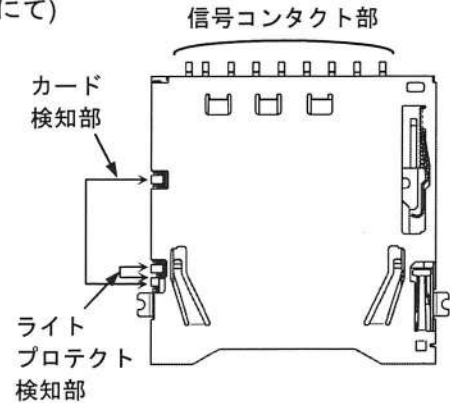
濃度： 3ppm
槽温度： +40°C
槽湿度： 80%RH
放置状態： 嵌合状態

判定基準

96時間放置後

- a) 外観： 変形、ソリ、クラックの発生なきこと
- b) 絶縁抵抗： 100MΩ以上 (D.C.500Vにて)
- c) 耐電圧： A.C. 500V・1分間 (検知電流1mAにて)
- d) 接触抵抗

信号コンタクト部： 変化量40mΩ以下
カード検知部： 150mΩ以下
ライトプロテクト検知部： 150mΩ以下



試験結果

a) 外観： 変形、ソリ、クラックの発生は見られない

b) 絶縁抵抗

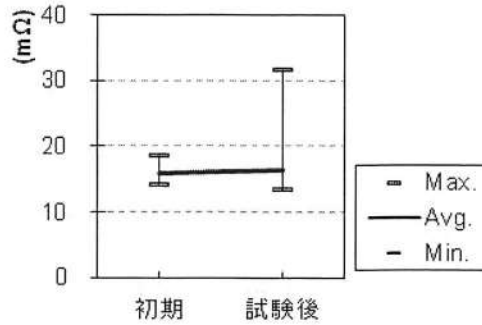
測定箇所	結果
隣接コンタクト間	すべて100MΩ以上
シェルー各コンタクト間	

c) 耐電圧

測定箇所	結果
隣接コンタクト間	短絡、絶縁破壊の問題なし
シェルー各コンタクト間	

d) 接触抵抗

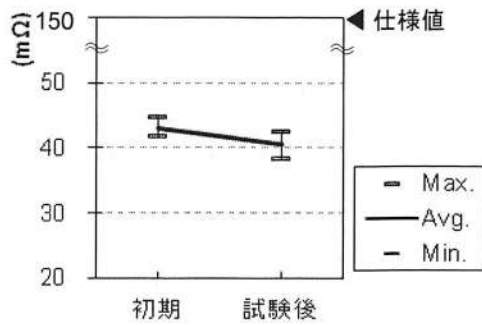
・信号コンタクト部



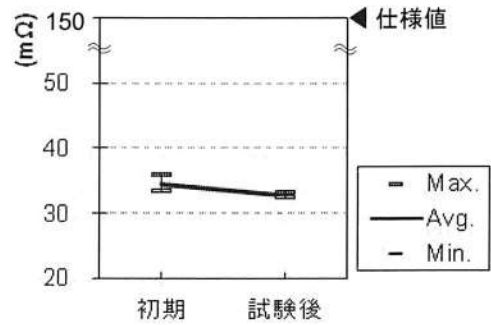
変化量 [mΩ]

Avg.	0.661
Max.	16.23
Min.	-2.63

・カード検知部



・ライトプロテクト検知部



結論

性能を満足する